මහජන අදහස් සඳහා ප්‍රමිති කෙටුම්පත
பொதுசனக் கருத்துரைக்கான கட்டளை வரைவு
DRAFT STANDARD FOR PUBLIC COMMENT

(වෙනස්විමට ඉඩ ඇත. திருத்தத்திற்குட்படக்கூடியது. Liable to alteration)

නිකුත් කල දිනය வெளியீட்டுத் திகதி Date of Issue	2023-03-03	අදහස් එවියයුතු අවසාන දිනය அபிப்பிராயங்களை தெவிப்பதற்கான இறுதித்திகதி Latest Date for Receipt of Comments	2023-05-03

Draft Sri Lanka Standard

SURFACE CHEMICAL ANALYSIS - AUGER ELECTRON SPECTROSCOPY AND X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY -GUIDE TO THE USE OF EXPERIMENTALLY DETERMINED RELATIVE SENSITIVITY FACTORS FOR THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF HOMOGENEOUS MATERIALS

(DSLS .... : ....) (ISO 18118 : 2015)

X-ray ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝන වර්ණාවලීක්ෂය හා ඕගර් ඉලෙක්ට්‍රෝන වර්ණාවලික්ෂය භාවිතා කර මතුපිට රසායනික විශ්ලේෂණයේදී, සමජාතිය ද්‍රව්‍යය ප්‍රමාණාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණාත්මකව නිර්ණය කල සාපේක්ෂ සංවේදිතා සාධක සඳහා උපදෙස් අඩංගු

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කෙටුම්පත

(ශ්‍රීලංප්‍ර කෙටුම්පත .... : ....) (ISO 18118 : 2015)

මෙම කෙටුම්පත ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියක් ලෙස නොසැලකිය යුතු මෙන් ම භාවිතා නොකළ යුතු ද වේ.
இவ்வரைவு இலங்கைக் கட்டளையெனக் கருதப்படவோ அன்றிப் பிரயோகிக்கப்படவோ கூடாது
This draft should not be regarded or used as a Sri Lanka Standard.

අදහස් එවිය යුත්තේ : ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, 17, වික්ටෝරියා පෙදෙස, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08.

Comments to be sent to: SRI LANKA STANDARDS INSTITUTION, 17, VICTORIA PLACE, ELVITIGALA MAWATHA, COLOMBO 08.

හැඳින්වීම

මෙම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කෙටුම්පත , ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් සකසන ලදුව, සියලුම උද්‍යෝගී අංශ වලට තාක්ෂණික විවේචනය සඳහා යවනු ලැබේ.

අදාල අංශ භාර කමිටු මාර්ගයෙන් ආයතනයේ මහා මණ්ඩල වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර , ලැබෙන සියලුම විවේචන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් සලකා බලා අවශ්‍ය වේනම් කෙටුම්පත සංශෝධනය කරනු ලැබේ.

මෙම කෙටුම්පතට අදාල යෝජනා හා විවේචන නියමිත දිනට පෙර ලැබෙන්නට සැලැස්වුවහොත් අගය කොට සලකමු. තවද, මෙම කෙටුම්පත පිළිගත හැකි බැව් හැගෙන අය ඒ බව දන්වන්නේ නම් එය ආයතනයට උපකාරී වනු ඇත.

මේ පිළිබඳව එවන සියලුම ලිපි පහත සඳහන් ලිපිනයට එවිය යුතුය.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය,
17, වික්ටෝරියා පෙදෙස,
ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ 08.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Introduction

This Draft Sri Lanka Standard has been prepared by the Sri Lanka Standards Institution and is now being circulated for technical comments to all interested parties.

All comments received will be considered by the SLSI and the draft if necessary, before submission to the Council of the Institution through the relevant Divisional Committee for final approval.

The Institution would appreciate any views on this draft which should be sent before the specified date. It would also be helpful if those who find the draft generally acceptable could kindly notify us accordingly.

All Communications should be addressed to:

The Director General
Sri Lanka Standards Institution,
17, Victoria Place,
Elvitigala Mawatha,
Colombo 08.

Draft Sri Lanka Standard

SURFACE CHEMICAL ANALYSIS — AUGER ELECTRON SPECTROSCOPY AND X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY — GUIDE TO THE USE OF EXPERIMENTALLY DETERMINED RELATIVE SENSITIVITY FACTORS FOR THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF HOMOGENEOUS MATERIALS

DSLS ISO 18118: ……
ISO 18118: 2015

Gr.

For public comments

Copyright Reserved

SRI LANKA STANDARDS INSTITUTION
17, Victoria Place
Elvitigala Mawatha
Colombo - 08
Sri Lanka.

Draft Sri Lanka Standard
Surface chemical analysis — Auger electron spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy — Guide to the use of experimentally determined relative sensitivity factors for the quantitative analysis of homogeneous materials

NATIONAL FOREWORD

This Sri Lanka Standard was approved by the Sectoral Committee on Chemical and Polymer Technology and was authorized for adoption and publication as a Sri Lanka Standard by the Council of the Sri Lanka Standards Institution on ……………………

This Sri Lanka Standard is identical with **ISO 18118: 2015** Surface chemical analysis — Auger electron spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy — Guide to the use of experimentally determined relative sensitivity factors for the quantitative analysis of homogeneous materials, published by the International Organization for Standardization (ISO). The text of the International Standard **ISO 18118: 2015** has been accepted for adoption as a Sri Lanka Standard.

This Sri Lanka Standard gives guidance on the measurement and use of experimentally determined relative sensitivity factors for the quantitative analysis of homogeneous materials by Auger electron spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy.

TERMINOLOGY AND CONVENTIONS

The text of the International Standard has been accepted as suitable for publication without deviation, as a Sri Lanka Standard. However, certain terminology and conventions are not identical with those used in Sri Lanka Standards; attention is therefore drawn to the following.

a) Wherever the words "International Standard" appear referring to this Standard they should be interpreted as "Sri Lanka Standard".
b) Wherever page numbers are quoted they are the page numbers of ISO Standard.

CROSS REFERENCES

International Standard	Corresponding Sri Lanka Standard
ISO 18115, Surface chemical analysis — Vocabulary	No corresponding Sri Lanka Standard
ISO 21270, Surface chemical analysis — X-ray photoelectron and Auger electron spectrometers — Linearity of intensity scale	No corresponding Sri Lanka Standard

For public comments